



Najważniejsze dane techniczne:

Objętość: $200 \times 200 \times 70 \text{ mm}^3 = 0,028 \text{ m}^3$

Zasada pomiaru: skanowanie interferometrii światła białego (Michelson)

Metody pomiaru i oceny	Skanowanie spójno ci, gładkie powierzchnie	Skanowanie spójno ci, szorstkie powierzchnie	Przesunięcie fazowe
Odchylenie płaskości	< 75 nm	< 125 nm	< 65 nm
Powtarzalność	5 nm	10 nm	< 1,5 nm